L3 ANSWER 1 OF 1 WPIX COPYRIGHT 2004 THOMSON DERWENT on STN

AN 2000-056601 [05] WPIX

DNN N2000-044163 DNC C2000-015290

TI Thin film for electrodes of semiconductor devices - comprises ethyl cyclopentadienyl (1,5-cyclooctadiene) iridium.

DC E12 L03 M13 U11 U12 U14

PA (KOJU-N) KOJUNDO KAGAKU KENKYUUSHO KK

CYC 1

PI JP 11292888 A 19991026 (200005)* 5<-- JP 3511228 B2 20040329 (200423) 5

ADT JP 11292888 A JP 1998-129407 19980403; JP 3511228 B2 JP 1998-129407 19980403

FDT JP 3511228 B2 Previous Publ. JP 11292888

PRAI JP 1998-129407 19980403

=>

=>

=> LOG Y

COST IN JAPANESE YEN

SINCE FILE TOTAL
ENTRY SESSION
FULL ESTIMATED COST

2267
2296

STN INTERNATIONAL LOGOFF AT 09:16:21 ON 28 APR 2004

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-292888

(43)Date of publication of application: 26.10.1999

(51)Int.Cl.

CO7F 15/00

C23C 16/18

(21)Application number: 10-129407

(71)Applicant :

KOJUNDO CHEM LAB CO LTD

(22)Date of filing:

03.04.1998

(72)Inventor:

KADOKURA HIDEKIMI

(54) ETHYLCYCLOPENTADIENYL (1, 5-CYCLOOCTADIENE) IRIDIUM AND ITS PRODUCTION AND PRODUCTION OF IRIDIUM-CONTAINING THIN FILM USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an Ir compound which is a liquid at room temperature and which is useful for forming Ir or IrO2 films used as thin films for the electrodes of semiconductor devices by a chemical gaseous phase growth method (CVD method), to provide a method for producing the compound, and to provide a method for forming the film from the compound. SOLUTION: New ethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)iridium (C2H5C5H4) Ir(C8H12). The new compound is liquid at room temperature, has a sufficient vapor pressure at approximately 100° C, can thereby quantitatively be fed by a gas bubbling method or a liquid mass flow controller method, and can be thermally decomposed on a 300° C substrate to form a pure Ir thin film in a low oxygen fractional pressure atmosphere. The compound can be produced in the maximum yield by reacting bis(1, 5-cyclooctadienechloroiridium) with sodium ethylcyclopentadienide in a solvent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.12.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-292888

(43)公開日 平成11年(1999)10月26日

(51) Int.Cl.6

C07F 15/00 C23C 16/18 說別記号

FΙ

C 0 7 F · 15/00

C 2 3 C 16/18

E

審査請求 未請求 請求項の数3 書面 (全 5 頁)

(21)出顧番号

特願平10-129407

(71)出願人 000143411

株式会社高純度化学研究所

埼玉県坂戸市千代田5丁目1番28号

(22)出顧日

平成10年(1998) 4月3日

(72)発明者 門倉 秀公

東京都豊島区千川町1丁目25番7号203室

(54) [発明の名称] エチルシクロベンタジエニル (1, 5 - シクロオクタ ジエン) イリジウムとその製造方法及び それを用いた イリジウム合有薄膜の製造方法

(57)【要約】

【課題】 半導体装置の電極用薄膜として、Ir, Ir O₂ 膜をCVD法でつくるための室温で液体のIr化合物とその製造方法およびその化合物を用いて膜をつくる方法を提供することである。

【解決手段】 新規化合物であるエチルシクロペンタジエニル(1、5 -シクロオクタジエン)イリジウム(C2HsC5H4)Ir(CsH12)は、室温で液体であり、100℃付近で充分な蒸気圧を有しているので、CVD原料として、ガスパブリングないし液体マスフローコントローラーにより定量的に供給でき、低酸素分圧雰囲気中、300℃の基板上で熱分解し、純Ir薄膜を形成することができた。該化合物は、ビス(1、5 -シクロオクタジエンクロロイリジウム)とナトリウムエチルシクロペンタジエニドを溶媒中で反応させて高収率で製造できた。

【特許請求の範囲】

【 請求項 1 】 エチルシクロペンタジエニル(1 , 5 -シクロオクタジエン)イリジウム。

【請求項2】 ビス(1.5-シクロオクタジエンクロロイリジウム)とナトリウムエチルシクロベンタジエニドを溶媒中で反応させるエチルシクロベンタジエニル(1.5-シクロオクタジエン)イリジウムの製造方法。

【請求項3】 イリジウム含有薄膜を化学気相成長によ 。 H₄) I r(C。 H₁2)からの蒸気を水素ガスに同りつくる方法で、加熱した基板をエチルシクロペンタジ 10 伴させさ、120℃の溶融シリカ基板に炭素 1 原子%以エニル(1,5-シクロオクタジエン)イリジウムと接 下のイリジウム金属の膜をCV D法で形成したことが開 触させることを特徴とするイリジウム含有薄膜の製造方 示されている。更には、80℃に保った(C。 H。) I r(C。 H,2)や(C H。 C。 H4) I r(C。 H

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エチルシクロペンタジエニル(1, 5 – シクロオクタジエン)イリジウム(C_2 H_5 C_5 H_4) I_r (C_8 H_{12}) とその製造方法及びそれを用いて化学気相成長法(以下CVD法と表す)によりイリジウム含有薄膜を製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ULSIの高集積化に伴い、キャ パシターとして髙誘電率の(Ba, Sr) TiO。薄 膜、強誘電体のPb(Zr,Ti)〇。薄膜などが開発 されつつある。この電極として、「「および/または」 rO₂薄膜が検討されている。該Ir薄膜の製法として は、Ir金属のスパッタリングが多く用いられ、TrO 。薄膜の製法としては I r 金属の反応性スパッタリング が多く用いられているが、より微細化した場合のステッ プカバレジや量産性への対応として、CVD法が期待さ れている。CVD法に用いる揮発性のIr化合物として は、トリス(ジピバロイルメタナート)イリジウムIr (dpm) s やトリス (アセチルアセトナート) イリジ ウムIr(acac)sやシクロベンタジエニル(1, 5-シクロオクタジエン) イリジウム(C。H。) Ir $(C_{\mathbf{8}} H_{12})$ やメチルシクロペンタジエニル (1, 5)−シクロオクタジエン)イリジウム(CH。C。H。) Ir(C₈ H₁₂)などが検討されている。

【0003】平成7年春季第42回応用物理学関係連合 講演会講演予稿集p491、30-p-D-14(中林 ら)では、CVD法で原料としてIr(dpm)。を用 い、500~600℃のSi基板上にIrを成膜し、そ の後空気中、600℃で熱処理して、IrO2としたことが開示されている。しかしIr(dpm)。は融点2 35℃の室温では固体結晶であり、0.1Torrの蒸 気圧は150℃付近であり、昇華による供給となる。

【0004】平成7年秋季第56回応用物理学会学術講演会講演予稿集p400,27p-ZG-3(老月5)では、CVD法で原料としてIr(acac)。を用

い、400°CのMg ○基板上にIrO2を成膜したことが開示されている。しかしIr(acac)。は融点269°Cの室温では固体結晶であり、0.1Torrの蒸気圧は180°C付近であり、昇華による供給となる。[0005] J. B. Hoke, E. W. Steとrnand H. H. Murray, J. Mater. Chem. Vol. 1,551(1991)には、95°Cに保った(C3H3)Ir(C3H12)や(CH3C3H4)Ir(C3H12)からの蒸気を水素ガスに同伴させさ、120°Cの溶融シリカ基板に炭素1原子%以下のイリジウム金属の膜をCVD法で形成したことが開示されている。更には、80°Cに保った(C3H3)Ir(C3H12)からの蒸気を酸素分圧1.3Torr下で酸化し、2.70°Cの基板に炭素と酸素が1原子%以下のイリジウムの膜をCVD法で形成したことが開示されていり

2

[0006]USP5130172では、100℃以下 の加熱で得られたし。MR。で表される有機金属化合物 の蒸気を、190℃以下の加熱基板にさらし、次いで、 100℃以下で水素ガスにさらし、該有機金属と水素を 反応させ、金属膜をコーティングするプロセスが開示さ れている。ととで、L、MR、において、Lは、水素、 エチレン、アリル、メチルアリル、ブタジエニル、ペン タジエニル、シクロペンタジエニル、メチルシクロペン タジエニル、シクロヘキサジエニル、ヘキサジエニル、 シクロヘプタトリエニル、またはこれらの誘導体で、炭 素数5より小さいアルキル側鎖を少なくとも一つ持つも のを表し、Mは、容易に二つの酸化状態をサイクルで き、かつ炭化水素配位子を触媒水添できる金属を表し、 Rは、メチル、エチル、プロピル、ブチルを表し、n は、Oから金属の価数までの整数で、mは、Oから金属 の価数までの整数で、かつ(n+m)が金属の価数とな る。化合物名を特定したクレームに記載されたTr化合 物は、トリアリルイリジウム(C。H。)。Ir、シク ロベンタジエニル (ヘキサジエン) イリジウム (C。H 。) Ir (C。H,。)、シクロベンタジエニル(シク ロヘキサジエン) イリジウム (Cs Hs) Tr(Cs H 。)、ペンタメチルシクロペンタジエニルイリジウムビ ス(エチレン) (C₅ (CH₃)₅) Ir (C₂ Ḥ₄) 』である。

【0007】上記の化合物のうちで、融点が文献 Dictionary of Organometallic Compounds, Vol. 2 (2nd Ed. 1996, Chapman & Hall) などに記載されているものを挙げると表1となる。表1からわかるように、すべての化合物は室温25℃で固体である。

[0008]

【表1】

50



化合物の融点一覧表

化合物	· 化学式	融点(℃)
トリス(アセチルアセトナート)イリン・ウム	Ir(C ₅ H ₁ 1O ₂) ₃	269
トリス(ジピバロイルメタナート)イリジウム	Ir(C11H19O2)3	235
シクロへ。 ソタシュニか(シクロオクタシェス) イリシュウマ	(C ₅ H ₅)Ir(C ₈ H ₁₂)	122-127
メチルシクロへ°ンタシ、エニル(ソクロオクタン、エン)イリシ、ウム	(CH ₃ C ₅ H ₄)Ir(C ₈ H ₁₂)	40
ト リア リル イ リジ ウ ム	Ir(C ₃ H ₅) ₃	65
シクロへ。フタシ、エニル(シクロヘキサシ、エン) イリシ、ウム	(C5H5)Ir(C6H8)	固体
へ。 ンタメチルシクロヘ、ンタン、エニルイリシ、ウムヒ、ス(エチレン)	(C ₅ (CH ₃) ₅)Ir(C ₂ H ₄) ₂	79-84

【0009】CVD法において、原料化合物を昇華で供給する方式は、液体で供給する方式やキャリヤーガスの 20 パブリングによる液体の蒸発で供給する方式に比べ、定量性、制御性、量産性が劣っている。また加熱して液体にできれば、蒸発で供給できるためかなり制御性が向上する。しかし、それでも室温で液体の化合物を使う場合にくらべ、使用できる方式や装置に制約が付く。そのため室温で液体であり、加熱して充分な蒸気圧を有する原料化合物が求められている。しかしCVD法でIrの薄膜を形成でき、室温25℃で液体でかつ蒸気圧を有する化合物は公知でない。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとする課題は、CVD法でIr、IrO₂薄膜を形成する際、室温25℃で液体で、かつ充分な蒸気圧を有する化合物を開示し、それを用いてCVDを行いIr、IrO₂薄膜をつくる方法を提供することである。さらにその化合物の製造方法を提供することである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者は、長年有機金属化合物の合成およびそれを用いたCVDを研究してきた。上記課題を解決するために、未公知のエチルシクロ 40 ペンタジエニル(1,5-シクロオクタジエン)イリジウム(C2 Hs Cs H4)Ir(Cs H12)を合成し、精製し、融点、蒸気圧を測定したところ、好ましい物性であり、さらにそれを用いCVDでIr、IrO2膜を作ったところ、安定して良好な膜が得られることを見いだし本発明を完成するに至った。すなわち本発明は、Ir、IrO2膜をCVD法でつくるための室温25℃で液体の原料として、エチルシクロペンタジエニル(1,5-シクロオクタジエン)イリジウム(C2 Hs Cs H4)Ir(Cs H12)を見いだしたことによ 50

る。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の化合物はエチルシクロペ ンタジエニル (1, 5 -シクロオクタジエン) イリジウ ム (C2 H5 C6 H4) Ir (C8 H12) である。本 発明は、量産性に優れた上記化合物の製造方法である。 その原型は、J. B. Hoke, E. W. Stern and H. H. Murray, J. Mater. Ch em. Vol: 1, 551 (1991) に開示されたメ チルシクロペンタジエニル(1,5-シクロオクタジエ ン) イリジウムの合成法である。それはTHF中で、ビ 30 ス(1,5-シクロオクタジエングロロイリジウム) [(C₈ H₁₂) I r C l]₂ とナトリウムメチルシク ロベンタジエニドNa (CH, C, H,)を-78℃か ら室温で撹拌反応させ、回収し、昇華すると、Ir につ いて81%の収率で、メチルシクロペンタジエニル (1,5-シクロオクタジエン) イリジウム (CH₃C ₅ H₄) Ir (C₈ H₁₂) が得られることを開示して いる。

【0013】本発明者は、Hoke 6の方法において、ナトリウムメチルシクロペンタジエニドの代わりに、ナトリウムエチルシクロペンタジエニドを用いて同様な条件で反応させれば目的のエチルシクロペンタジエニル(1.5-シクロオクタジエン)イリジウム(C_2H_s C_6H_4) Ir (C_8H_{12}) が得られることを見いだした。

【0014】反応後、THF溶媒を減圧留去し、生成している粘ちょう物から目的物をヘキサンで抽出し、ヘキサンを減圧留去し、ついて真空蒸留すると(105℃/0.3Torr)淡黄色の液体が得られた。この液体を、1r含有量分析、CH分析および「H-NMR分析のたまチルシクロペンタジエニル(1.5-シクロオク

タジエン) イリジウム (C2 H6 C6 H4) Ir (C8 H12)と同定した。融点は14℃で過冷却しやすい液 体であり、室温での粘度は約20cP程度である。空気 中で安定で水と反応しにくい。熱安定性が高く、Ar雰 囲気1気圧下のTG-DTAによれば、260℃で10 0%蒸発した。

【0015】本発明は、電子材料の原料として使い得る 高純度のエチルシクロペンタジエニル(1,5-シクロ オクタジエン) イリジウム (C2 H5 C5 H4) Ir (C。H₁2)を合成する方法でもある。

【0016】本発明は、エチルシクロペンタジエニル (1,5-シクロオクタジエン)イリジウム(C₂H₅ C₅ H₄) Tr (C₈ H₁₂)を用いて、CVD法でI r含有薄膜をつくる方法でもある。この化合物を80~ 150°C程度に保ち、この液に減圧下でキャリヤーガス をバブリングさせ蒸発同伴させ、熱分解反応器中に送 り、水素雰囲気中100~500℃の基板上で熱分解さ せると1 r 薄膜が形成できる。また、低酸素分圧中25 0~500℃の基板上で熱分解させると I r 薄膜が形成 フローコントローラーで供給して蒸発させる方式も可能 である。

【0017】本発明で [r薄膜を形成する第一の方法 は、水素雰囲気下、100~500℃の基板上で熱分解 **する方法である。水素雰囲気下で得られる I r 薄膜は、** きれいな鏡面で、炭素取り込みの少ない金属膜である。 IrO₂薄膜を得るには、550°C以上で酸素ガス共存 下に熱分解するか、 І г 薄膜を形成後、酸素を含んだ雰 囲気中で550℃以上で熱処理することによって得られ る。

【0018】本発明で Ir 薄膜を形成する第二の方法 は、低圧酸素雰囲気下、250~500℃の基板上で熱 分解する方法である。低圧酸素雰囲気下で得られる【 r 薄膜は、きれいな鏡面で、炭素や酸素の取り込みの少な い金属膜である。との方法は、還元雰囲気を嫌う化合物*

* の上に膜付けする時に好都合である。

[0019]

【実施例1】エチルシクロペンタジエニル(1,5-シ クロオクタジエン) イリジウム (C2 H6 C6 H4) I r(CaHi2)の製造リフラックスコンデンサー、温 度計、滴下ロート、撹拌羽根を備えた500m1四口フ ラスコを真空置換しアルゴン雰囲気とし、THF350 mlを仕込み、次いで、ピス(1,5-シクロオクタジ エンクロロイリジウム) [(C, H, 2) IrCl] 2 10 16.8g(25.0mmol)を仕込み溶解させた。 この反応フラスコを-78℃に冷却し、撹拌しながら、 **滴下ロートからナトリウムエチルシクロペンタジエニド** Na (C₂ H₅ C₅ H₄) 7. 2g (62. 0mmo 1) のTHF溶液31m1を添加した。-78℃で30 分撹拌後、徐々に室温まで昇温し、室温で30分撹拌し た。次いで、減圧下で溶媒類を留去し、残った粘ちょう 物にヘキサン300mlを加え溶解した。少量の沈澱物 を濾過により除き、ヘキサンを留去し、約0.3 Tor rで真空蒸留すると、100~110℃の留分として淡 できる。パブリングで蒸発供給する代わりに、液体マス 20 黄色の液体が15.2g得られた。この液体は、以下の 同定により、エチルシクロペンタジエニル(1,5-シ クロオクタジエン) イリジウム (C2 Hs Cs H4) I r (C_a H₁₂) であり、38.6m. molに相当 し、収率77%であった。

【0020】同定

- 50.8wt% (理論值 48. (1) Ir 分析値 84wt%) `
- C45. 36wt% H5. 4 (2) C H 分析 2wt% (理論値 C45.78wt% H5.38w 30 t%)
 - (3) H-NMR

装置 BRUKER AC300P(300MHz) 方法 1D 溶媒 CD2C12 スペクトルと帰属

δн(ррπ)	プロトン数	帰属
1. 15	3 H	CH ₉ ; Et
1. 76	4 H	CH ₂ ; Cyclooctadiene
2. 01	4 H	CH2; Cyclooctadiene
2. 25	2 H	CH2; Et
3. 58	4 H	CH; Cyclooctadiene
4. 99~5.	32 4 H	CH: Cyclopentadieny

【0021】物性と純度

- 過冷却しやすい (4)融点 14℃
- (5) 蒸気圧 100~110℃/0.3Torr
- (6)密度 約1.5g/cm⁸
- (7)粘度 約20cP(室温)
- (8) 反応性 空気、水とは反応せず安定
- (9) 熱安定性 150℃で安定

(10) TG-DTA

測定条件; Arl 気圧下、試料重量 12.67 mg、 昇温速度 10.0deg/min 結果:約120℃から減量が開始し、240℃で50 %、260℃で100%減量した。

(11) 純度

50 不純物分析値(単位ppm)

7

Fe 1, A1 <1, Si 3, Na <1, Ca 1,

上記のとおり髙純度であった。

[0022]

【実施例2】エチルシクロペンタジエニル(1,5-シ クロオクタジエン) イリジウム (C2 H5 C5 H4) I ~r(C。H」。)を用いたCVD法による純Ir薄膜の 製造原料容器および熱分解反応器の全系をロータリー真 空ポンプと圧力調節弁で10Torrの減圧に保った。 エチルシクロペンタジェニル(1,5-シクロオクタジ 10 エン) イリジウム (C2 H5 C5 H4) Ir (C8 H 12)13gを充填した原料容器を100℃の恒温槽に 入れ、キャリヤーガスArを10sccmでパブリング し、このガスにエチルシクロペンタジエニル(1.5-シクロオクタジエン)イリジウムを蒸発同伴させ、熱分 解反応器に導入した。同時に水素ガス100gccmも 熱分解反応器に導入した。熱分解反応器中では、400 ℃に加熱された石英基板がセットされており、エチルシ クロペンタジエニル(1,5-シクロオクタジエン)イ リジウムがこの基板上において分解し、純 1 r 薄膜が2 5分間で50nmの厚みに形成された。XRDにより金 属Irであることを同定した。膜を溶解し、金属不純物 をICP発光分析で分析したが、Iェ以外の金属不純物 は検出されなかった。

[0023]

【実施例3】エチルシクロペンタジエニル(1、5-シ クロオクタジエン)イリジウム(C_2 H_5 C_5 H_4) I r (C_8 H_{12}) を用いたCVD法による純I r 薄膜の製造原料容器および熱分解反応器の全系をロータリー真空ポンプと圧力調節弁で10T0rr0減圧に保った。エチルシクロペンタジエニル(1, $5-シクロオクタジェン)イリジウム(<math>C_2$ H_5 C_5 H_4)Ir (C_8 H

8

12)13gを充填した原料容器を100℃の恒温槽に入れ、キャリヤーガスArを10sccmでパブリングし、とのガスにエチルシクロペンタジエニル(1,5-シクロオクタジエン)イリジウムを蒸発同伴させ、熱分解反応器に導入した。 制分解反応器中では300℃に加熱された石英基板がセットされており、エチルシクロペンタジエニル(1,5-シクロオクタジエン)イリジウムがこの基板上において分解し、純Ir薄膜が30分間で60nmの厚みに形成された。XRDより、金属Irであることを同定した。その膜を溶解し、金属不純物をTCP発光分析で分析したが、Ir以外の金属不純物は検出されなかった。

[0024]

実施例3において、形成した純Ir薄膜を600°Cで酸素雰囲気にすると、IrOz薄膜となった。同定はXR Dで行った。

[0025]

【発明の効果】本発明のエチルシクロペンタジエニル(1,5-シクロオクタジエン)イリジウム(C2H。C3H4)Ir(C3H12)は室温で液体であり、100℃付近で充分な蒸気圧を有しているので、CVD原料として、ガスパブリングないし液体マスフローコントローラーにより定量的に供給でき、熱分解で基板上にIr含有薄膜を形成することができる。本発明により、量産性に優れたCVD法で純IrやIrO2の薄膜を形成できる。

	ง	[Translation done.
LAIMS <u>DETAILED DESCRIPTION T</u> IVENTION TECHNICAL PROBLEM	ECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE MEANS	THE COLUMN
ranslation done.]		
NOTICES *		
apan Patent Office is not respons amages caused by the use of this t	ranslation.	
This document has been translated riginal precisely. **** shows the word which can no. In the drawings, any words are not.		
ELAIMS		
ridium to which a screw (1, 5-cyclo- PENTAJIENIDO are made to react in Claim 3] The manufacture approach contacting the substrate which heat	of the ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) -octadiene chloro iridium) and sodium ethyl cyclo	
Translation done.]		

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the approach of manufacturing an iridium content thin film by the chemical-vapor-deposition method (it expressing a CVD method below) using ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12), its manufacture approach, and it.

[Description of the Prior Art] In recent years, TiO(Ba, Sr)3 thin film of a high dielectric constant, Pb(Zr, Ti) O3 thin film of a ferroelectric, etc. are being developed as a capacitor with high integration of ULSI. Ir and/or IrO2 thin film is examined as this electrode. Although many sputtering of Ir metal is used and many reactive sputtering of Ir metal is used as a process of TrO2 thin film as a process of this Ir thin film, the CVD method is expected as correspondence to the step hippo register and mass-production nature at the time of making it detailed more. As an volatile Ir compound used for a CVD method, tris (dipivaloyl meta-NATO) iridium Ir(dpm) 3, tris (acetylacetonato) iridium Ir(acac) 3, cyclo BENTA dienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C5H5) Ir (C8H12), methylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (CH3C5H4) Ir (C8H12), etc. are examined.

[0003] In the collection p491 of the 42nd time applied physics relation union lecture meeting lecture drafts of the Heisei 7 spring, and 30-p-D -14 (Nakabayashi et al.), having formed Ir on 500-600-degree C Si substrate with the CVD method, using Ir (dpm)3 as a raw material, having heat-treated at 600 degrees C among air after that, and having been referred to as IrO2 is indicated. However, at a room temperature with a melting point of 235 degrees C, Ir (dpm)3 is a solid-state crystal, and the vapor pressure of 0.1Torr is near 150 degree C, and it serves as supply by sublimation.

[0004] In the collection p400 of the 56th time Japan Society of Applied Physics academic lecture meeting lecture drafts of the Heisei 7 autumn, and 27 p-ZG -3 (old moons), having formed IrO2 on the 400-degree C MgO substrate with the CVD method, using Ir (acac)3 as a raw material is indicated. However, at a room temperature with a melting point of 269 degrees C, Ir (acac)3 is a solid-state crystal, and the vapor pressure of 0.1Torr is near 180 degree C, and it serves as supply by sublimation. [0005] J.B. It is rn as Hoke and E.W.Ste. and H.H.Murray and J.Mater.Chem.Vol.1,551 (1991), Having made the steam from Ir (C5H5) (C8H12) or Ir (CH3C5H4) (C8H12) kept at 95 degrees C accompany to hydrogen gas, and having formed the film of the iridium metal below carbon 1 atom % in ** and a 120-degree C fused silica substrate with the CVD method is indicated. Furthermore, it is indicated that oxidized the steam from Ir (C5H5) (C8H12) or Ir (CH3C5H4) (C8H12) kept at 80 degrees C under oxygen tension 1.3Torr, and carbon and oxygen formed the film of the iridium below 1 atom % in the 270-degree C substrate with the CVD method.

[0006] In USP5130172, the steam of the organometallic compound expressed with LnMRm obtained with heating of 100 degrees C or less is exposed to a heating substrate 190 degrees C or less, subsequently to hydrogen gas, expose below 100 degrees C, this organic metal and hydrogen are made to react, and the process which coats a metal membrane is indicated. Here, set to LnMRm. L Hydrogen, ethylene, an allyl compound, a methyl allyl compound, swine dienyl, pentadienyl, With cyclopentadienyl, methylcyclopentadienyl, cyclohexa dienyl, cyclo heptatrienyl, or these derivatives A thing with at least one alkyl side chain smaller than a carbon number 5 is expressed. M The metal which can carry out the cycle of the two oxidization conditions easily, and can carry out catalyst hydrogenation of the brown coal–ized hydrogen ligand is expressed, and R expresses methyl, ethyl, propyl, and butyl, and n is an integer from 0 to a metaled valence, and (n+m) it becomes a metaled valence. Tr compounds indicated by the claim which specified the compound name are triaryl iridium (C3H5) 3Ir, cyclopentadienyl (hexadiene) iridium (C5H5) (C6H10) Ir, cyclo BENTA dienyl (cyclohexadiene) iridium (C5H5) (C6H8) Tr, and the pentamethylcyclopentadienyl iridium screw (ethylene) (C5(CH3) 5) Ir(C2H4) 2.

[0007] Among the above-mentioned compounds, the melting point is reference. Dictionary of Organometallic It will become Table 1 if what is indicated by Compounds, Vol.2 (2nd Ed.1996, Chapman & Hall), etc. is mentioned. As shown in Table 1, all compounds are solid-states at the room temperature of 25 degrees C. [0008]

[Table 1]

1

化合物	· 化学式	融点 (℃)
トリス(アセチルアセトナート)イリン* ウム	Ir(C ₆ H ₁ 1O ₂) ₃	269
トリス(ジピバロイルメタナート)イリジウム	Ir(C ₁₁ H ₁₉ O ₂) ₃	235
シクロへ。 ソタシ エニル(シクロオクタシ エン) イリシ ウム	(C ₅ H ₅)Ir(C ₈ H ₁₂)	122-127
メチルシクロへ° ンタシ゛エニル(シクロオクタシ゛エン)イリシ゛ウム	(CH ₃ C ₅ H ₄)Ir(C ₈ H ₁₂)	40
トリアリルイリシ゛ウム	Ir(C3H5)3	65
シクロへ。 ンタシ、エニル(シクロヘキサシ、エン) イリシ、ウム	(C5H5)Ir(C6H8)	固体
ላ° ンタメチルシクロላ° ンタシ° エニルイリシ` ウムヒ° ス(エチレン)	$(C_6(CH_3)_5)Ir(C_2H_4)_2$	79-84

[0009] In the CVD method, the method which supplies a raw material compound by sublimation is inferior in quantum nature, a controllability, and mass-production nature compared with the method supplied with a liquid, or the method supplied by evaporation of the liquid by bubbling of a carrier gas. Moreover, if it heats and is made to a liquid, since it can supply by evaporation, a controllability will improve considerably. However, constraint is attached to the method and equipment which can still be used compared with the case where the compound of a liquid is used, at a room temperature. Therefore, the raw material compound which is a liquid at a room temperature, heats and has sufficient vapor pressure is called for. However, the compound which the thin film of Ir can be formed with a CVD method, and is a liquid at the room temperature of 25 degrees C, and has vapor pressure is not well-known.

[0010]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In case the technical problem which this invention tends to solve forms Ir and IrO2 thin film with a CVD method, it is a liquid at the room temperature of 25 degrees C, and is offering the approach of indicating the compound which has sufficient vapor pressure, performing CVD using it, and building Ir and IrO2 thin film. It is offering the manufacture approach of the compound furthermore.

[Means for Solving the Problem] this invention person has studied CVD which has used composition and it of an organometallic compound for years, in order to solve the above-mentioned technical problem — the sheep — when well-known ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12) was compounded and refined and the melting point and vapor pressure were measured, it was desirable physical properties, and when Ir and IrO2 film were further made from CVD using it, it finds out that it is stabilized and the good film is obtained, and came to complete this invention. That is, this invention is because ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12) was found out as a raw material of a liquid at the room temperature of 25 degrees C for building Ir and IrO2 film with a CVD method.

[0012]

[Embodiment of the Invention] The compound of this invention is ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12). This invention is the manufacture approach of the above-mentioned compound excellent in mass-production nature. The pattern is J.B.Hoke and E.W.Stern. and It is the synthesis method of H.H.Murray and the methylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium indicated by J.Mater.Chem.Vol.1,551 (1991). It carries out the churning reaction of a screw (1, 5-cyclo-octadiene GURORO iridium) [(C8H12) IrCl] 2 and sodium methyl cyclo PENTAJIENIDO Na (CH3C5H4) at a room temperature from -78 degree C in THF. If it collects and sublimates, it will indicate about Ir that methylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (CH3C5H4) Ir (C8H12) is obtained with 81% of yield. [0013] In Hoke's and others approach, when this invention person uses sodium ethyl cyclo PENTAJIENIDO and it was made to react on the same conditions instead of sodium methyl cyclo PENTAJIENIDO, he found out that target ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12) was obtained.

[0014] After the reaction, reduced pressure distilling off of the THF solvent was carried out, the specified substance was extracted from ********** currently generated by the hexane, and when reduced pressure distilling off was carried out and vacuum distillation of the hexane was subsequently carried out (105 degrees C / 0.3Torr), the liquid of light yellow was obtained. This liquid was identified ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12) from Ir content analysis, CH analysis, and 1 H-NMR analysis. The melting point is a liquid which is easy to supercool at 14 degrees C, and the viscosity in a room temperature is about 20 cP extent. It is stable in air and hard to react with water. Thermal stability was high, and according to TG-DTA under Ar ambient atmosphere 1 atmospheric pressure, it evaporated 100% at 260 degrees C. [0015] This invention is also the approach of compounding the ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12) of the high grade which can be used as a raw material of an electronic ingredient.

[0016] This invention is also the approach of building Ir content thin film with a CVD method using ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Tr (C8H12). If this compound is kept at about 80-150 degrees C, bubbling of the carrier gas is carried out to this liquid under reduced pressure, evaporation company is carried out and a pyrolysis is carried out on a 100-500-degree C substrate among delivery and a hydrogen ambient atmosphere into a pyrolysis reactor, Ir thin film can be formed. Moreover, if a pyrolysis is carried out on a 250-500-degree C substrate among a hypoxia partial pressure, Ir thin film can be

formed. Instead of carrying out evaporation supply by bubbling, the method supplied and evaporated with a liquid massflow controller is also possible.

[0017] The primary method which forms Ir thin film by this invention is the approach of pyrolyzing under a hydrogen ambient atmosphere and on a 100-500-degree C substrate. Ir thin film obtained under a hydrogen ambient atmosphere is a metal membrane with little carbon incorporation in a beautiful mirror plane. In order to obtain IrO2 thin film, it is obtained by heat-treating above 550 degrees C in the ambient atmosphere which pyrolyzed under oxygen gas coexistence above 550 degrees C, or contained oxygen after forming Ir thin film.

[0018] The second approach of forming Ir thin film by this invention is the approach of pyrolyzing under a low-pressure-oxygen ambient atmosphere and on a 250-500-degree C substrate. Ir thin film obtained under a low-pressure-oxygen ambient atmosphere is a metal membrane with little incorporation of carbon and oxygen in a beautiful mirror plane. When carrying out film attachment of this approach on the compound which dislikes reducing atmosphere, it is convenient.

[0020] Identification (1) Ir analysis value 50.8wt% (theoretical-value 48.84wt%)

- (2) CH analysis C45.36wt% H5.42wt% (theoretical value C45.78wt% H5.38wt%)
- (3) 1 H-NMR equipment BRUKER AC300P (300MHz)

Solvent CD2C12 Approach 1D spectrum and attribution

δн(ррт)	プロトン数	帰属
1. 15	3 H	CH ₃ ; Et
1. 76	4 H	CH ₂ ; Cyclooctadiene
2. 01	4 H	CH2; Cyclooctadiene
2. 25	2 H	CH2; Et
3. 58	4 H	CH; Cyclooctadiene
4. 99~5.	32 4 H	CH; Cyclopentadieny

[0021] Physical properties and the purity (4) melting point 14 degrees C (5) vapor pressure which is easy to supercool 100-110 degrees C / 0.3Torr (6) consistency About 1.5 g/cm3 (7) viscosity About 20 cP(s) (room temperature)

(8) Reactivity Air and water do not react but are stabilization (9) thermal stability. It is 150 degrees C and they are the bottom of a stabilization (10) TG-DTA Measuring condition; Arl atmospheric pressure, and sample weight. 12.67mg, programming rate 10.0 deg/min result; loss in quantity began from about 120 degrees C, and its weight was reduced 100% at 260 degrees C 50% by 240 degrees C.

(11) Purity impurity analysis value (unit ppm)

Fe 1 aluminum <1, Si 3 Na <1, calcium It was a high grade 1 and as above-mentioned. [0022]

[Example 2] The whole system of the manufacture raw material container of the pure Ir thin film by the CVD method using ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12) and a pyrolysis reactor was maintained at reduced pressure of 10Torr(s) by the rotary vacuum pump and the pressure regulating valve. Put the raw material container filled up with ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir(C8H12)13g into the 100-degree C thermostat, carried out bubbling of the carrier gas Ar by 10sccm(s), this gas was made to carry out evaporation company of the ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium, and it introduced into the pyrolysis reactor. Hydrogen gas 100sccm was also introduced into the pyrolysis reactor at coincidence. In the pyrolysis reactor, the quartz substrate heated by 400 degrees C is set, ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium decomposed on this substrate, and the pure Ir thin film was formed in the thickness of 50nm in 25 minutes. It identified that it was Metal Ir by XRD. Although the film was dissolved and the metal impurity was analyzed by ICP AEM, metal impurities other than Ir were not detected. [0023]

[Example 3] The whole system of the manufacture raw material container of the pure Ir thin film by the CVD method using ethyloyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12) and a pyrolysis reactor was maintained at reduced pressure of 10Torr(s) by the rotary vacuum pump and the pressure regulating valve. Put the raw material container filled up with ethyloyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir(C8H12)13g into the 100-degree C thermostat, carried out bubbling of the carrier gas Ar by 10sccm(s), this gas was made to carry out evaporation company of the ethyloyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium, and it introduced into the pyrolysis reactor. Oxygen gas 20sccm was also introduced into the pyrolysis reactor at coincidence. In the pyrolysis reactor, the quartz substrate heated by 300 degrees C is set, ethyloyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium decomposed on this substrate, and the pure Ir thin film was formed in the thickness of 60nm in 30 minutes. From XRD, it identified that it was Metal Ir. Although the film was dissolved and the metal impurity was analyzed by TCP spectrographic analysis, metal impurities other than Ir were not detected.

[0024]

[Example 4] In the manufacture example 3 of pure IrO2 thin film by the CVD method using ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12), when the formed pure Ir thin film was made into the oxygen ambient atmosphere at

600 degrees C, it became IrO2 thin film. Identification was performed by XRD.

[Effect of the Invention] The ethylcyclopentadienyl (1, 5-cyclo-octadiene) iridium (C2H5C5H4) Ir (C8H12) of this invention is a liquid at a room temperature, since it has sufficient vapor pressure near 100 degree C, as a CVD raw material, can be quantitatively supplied with gas bubbling thru/or a liquid massflow controller, and can form Ir content thin film on a substrate by the pyrolysis. By this invention, pure Ir and the thin film of IrO2 can be formed with the CVD method excellent in mass-production nature.

[Translation done.]